Creator for the NEXT

DCLT-9600

Daitron

Daitron Chip LaserDiode Tester

本装置は Display 用向けレーザーダイオードの特性検査装置です。
高速 Pulse 駆動により電気的及び光学的な測定が可能です。

Key features

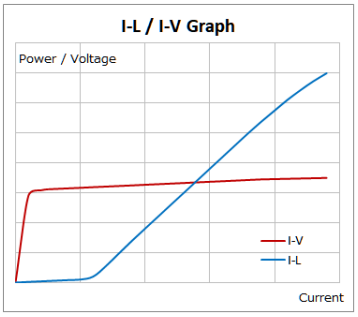
- オリジナル DAVI エンジンの画像処理による高速位置決め搭載
- 高精度の測定を実現（**測定値再現性 0.01%以下**）
- 供給から収納までフル自動計測可能
- 高速タクト測定を実現（**タクト 2sec**）

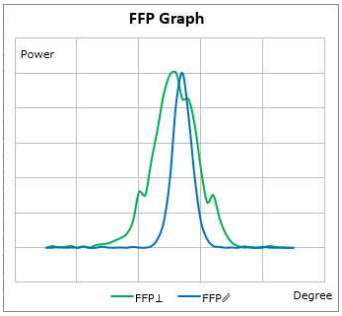
Functions

- 検査ステージ上デバイスの画像処理位置決め搭載
- 各種クリーニング機能(ステージ)
- 荷重測定機能(搬送コレット・プローブ)

Applications

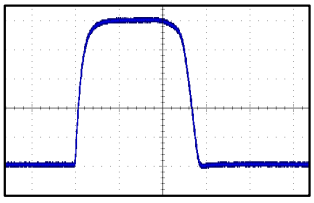
- I-L 測定
- 波長測定
- FFP 測定
- DC 測定（Ir / Vr）
- NFP 測定（Option）





Pulse Driver

Driver Line up	Current	Pulse Width
High Speed Pulse Driver 50	~50A	2usec ~
High Speed Pulse Driver 20	~20A	2usec ~
High Speed Pulse Driver	~6A	2usec ~



If:50A / 2usec Pulse

ダイトロン株式会社

Details

装置諸元	
・筐体寸法	~2000(W)×~2400(D)×~2150(H) mm
・ユーティリティ	電源：装置本体　三相 AC200V±10%　30A　1 系統 PC 用　単相 AC100V±10% 空圧源：要　真空源：要
・重量	～3000kg
標準機能	
・対象デバイス (参考)	LD チップ
・供給形態	グリップリング / 各種リング
・収納形態	各種リング
・電流測定	5A / 50A
・パルス幅	2.0~100usec (設定単位 1usec)
・パルス周期	0.1~20msec (設定単位 0.1msec　Duty 1%)
・電圧測定	12V
・光出力測定	10W/60W
・波長範囲	390~1000nm
・温度制御範囲	＋25℃～
・タクトタイム (参考)	2.0sec ※測定条件によって変わります
・安全機能	オープンショートチェック / フェイルチェック / 通電安全チェック
	変動監視機能 / リミット監視機能
測定機能	
・標準取得データ	IL：Iop / Vop / Ith / Vth / Pop / Eta / Rd / Kink
	λ ：λp / λd / λw
	FFP：θ∥ / θ⊥ / ⊿θ∥ / ⊿θ⊥
	DC ： LDVf/ LDIr
・オプション	NFP： W∥ / W(1/e) / W(1/e2)

※その他計測項目に関してもご対応可能です。

※IL&DC 以外の測定項目は測定光学系及び測定器に依存します。

※Pulse 性能に関しては対象デバイス及びパッケージの影響に依存します。

※デバイス治具・温調ステージ等もカスタム対応可能です。

お問合わせ先
ダイトロン株式会社　D&P カンパニー　計測機器工場　亀岡　営業担当
〒621-0013　京都府亀岡市大井町並河 3-13-1
TEL　0771-24-1011㈹　http://www.daitron.co.jp

製品ホームページ
（チップテスタ）

問い合わせ装置番号：DCLT-9600